

Anmeldung

Bitte faxen
030 – 63 92 65 01



Name _____

Vorname _____ Titel _____

Firma/Einrichtung _____

Adresse _____

Telefon _____ Fax _____

E-Mail _____

Poster ja nein

Titel _____

Teilnahmegebühren

100,00 € bei Überweisung bis zum 31.03.2003,
120,00 € bei Barzahlung vor Ort
IAP e.V. · Konto-Nr. 553 24 86 00
Deutsche Bank AG Berlin · BLZ 100 700 00

Anmeldung von Ausstellungsfläche

4 m² 6 m² 8 m²

Miete 25,00 €/m² bei Überweisung bis zum 31.03.03,
50,00 € bei Barzahlung vor Ort

Hotelreservierung gewünscht

Einzelzimmer Doppelzimmer

Ort, Datum

Unterschrift

Veranstalter

VDI/VDE – Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA);
VDI-Bezirksgruppe Adlershof;
Optec Berlin-Brandenburg e.V.;
IAP Institut für angewandte Photonik e.V.;
IfG – Institut für Gerätebau GmbH
FhG-IZM (Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit und Mikrointegration), Berlin;
TSB – Technologiestiftung, Berlin, Geschäftsstelle Adlershof;
IFV UV- und Röntgentechnologien, Berlin, Geschäftsstelle Adlershof

Organisation und Korrespondenzanschrift

Dipl.-Ök. A. Weiß (Organisation)
Tel.: (030) 63 92 – 65 09
Fr. Ch. Menzel (Sekretariat IAP e. V. und IfG GmbH)
Tel.: (030) 63 92 – 65 00
IAP Institut für angewandte Photonik e.V.
Rudower Chaussee 29/31
12489 Berlin
Fax: 6392-6501
E-Mail: menzel@ifg-adlershof.de

Programmkomitee

Programmkomitee:
W. Daum, BAM, Berlin;
W. Sandner, Max-Born-Institut, Berlin;
N. Langhoff, IfG GmbH, Berlin;
R. Wedell, IAP, Berlin;
B. Kämpfe, IZM, Berlin;
J. Heckel, Spectro GmbH, Kleve;
Th. Schüle, RÖNTEC AG, Berlin;
B. Beckhoff, PTB, Berlin;
B. Kanngießner, TU Berlin;
A. Janssen, FH Münster;
K. Janssens, Universität Antwerpen, Belgien;
B. Dollmann, STOE GmbH, Darmstadt;
M. Haschke, Röntgenanalytik Messtechnik GmbH, Taunusstein;
R. Meier, PANalytical, Almelo, Niederlande;
J. Flock, ThyssenKrupp Stahl AG, Duisburg;
S. Pahlke, Wacker Siltronic AG, Burghausen;
H. Knobloch, VDI/VDE - IT, Teltow



Anfahrtskizzen auch unter www.wista.de



Programm

Fachtagung

3. und 4. April 2003

im WISTA – Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Berlin-Adlershof,
Einstein-/Newton-Kabinett,

Rudower Chaussee 17
12489 Berlin



Donnerstag, 3. April 2003

10.00 Uhr Eröffnung
Prof. Dr. N. Langhoff, IfG, Prof. Dr. W. Daum, VDI

Mobile RFA-Spektrometer und Röntgendiffraktometer
Leitung: Prof. Dr. K. Janssens

10.15 Uhr Dipl.-Phys. U. Waldschläger, RÖNTEC GmbH: Mobile Röntgen-
geräte für Anwendungen in der Industrie, in der Umwelt-
analytik und für die Analyse von Kunst- und Kulturgütern

10.40 Uhr Dipl.-Ing. A. Giannikos, Analyticon Instruments GmbH:
Tragbare RF-Analysatoren mit Röntgenröhre

11.05 Uhr Dr. V. Kolarik, Fraunhofer Institut für Chemische Technologie
(ICT): Innovative assessment of industrial plant components
using real structure analysis by on site X-ray diffraction

11.20 Uhr Dipl.-Phys. R. Arnhold, RÖNTEC GmbH: Neue Entwicklungen
bei der Anwendung der energiedispersiven Röntgendiffrak-
tometrie (EDXRD) in der prozessnahen Analytik

11.35 Uhr Dr. Wehrhan, Schott Lihotec AG: Einsatz von Crysotax pro zur
Bewertung von CaF₂-Blanks

11.50 Uhr Dr. B. Baumgartner, STOE & CIE GmbH: Ein mobiles Kompakt-
Röntgenpulverdiffraktometer

12.05 Uhr BSc. B. Price, Oxford Instruments: The application of portable
XRF instruments using cold cathode x-ray tubes

12.30–13.30 Mittagspause

Softwareentwicklungen für prozessnahe Anwendungen
Leitung: Dr. M. Haschke

13.30 Uhr Prof. Dr. M. Mantler, TU Wien: Methoden der quantitativen RFA

14.10 Uhr Prof. Dr. K. Janssens, University of Antwerp: Softwareentwick-
lungen für Anwendungen der Mikro-RFA

14.35 Uhr Dipl.-Phys. F. Eggert, Röntgenanalytik GmbH: Limits, Simula-
tions- und Fehlerrechnungen in der Schichtdickenanalyse

14.50 Uhr – 15.05 Uhr Kaffeepause

Neue Methoden der Röntgenanalytik*
Leitung: Prof. Dr. N. Langhoff

15.05 Uhr Dr. B. Kanngießer, TU Berlin: 3D -Mikroröntgenfluoreszenz-
analyse

15.25 Uhr Dr. B. Beckhoff, PTB Berlin: Ultrapurenanalytik und Speziation
leichter Elemente mit SR-TRFA zur Anwendung in der Halb-
leiterindustrie

15.45 Uhr Dr. B. Kämpfe, FhG IZM: Möglichkeiten und Anwendungsfelder
der energiedispersiven Röntgendiffraktometrie

16.05 Uhr Dr. H. Stiel, MBI Berlin: Zeitaufgelöste Röntgentechniken in
der Grundlagenforschung

16.25 Uhr Dipl.-Phys. Starke, Laserzentrum Hannover e.V.: Anwendungs-
nahe Analysenverfahren mittels XUV-Spektralphotometer

17.00 – 18.00 Uhr Postersitzung

Dipl.-Ing. E. Auerswald, TU Berlin: Vergleich von Eigen-
spannungsmessungen mit konventioneller und energie-
dispersiver Röntgendiffraktometrie

A. Reinicke, FHTW Berlin: Experimentelle Ergebnisse der
energiedispersiven Röntgendiffraktometrie

A. Reinicke, FHTW Berlin: Charakterisierung von Münzen und
Medaillen mit Röntgentechniken

Dr. V. Alex, IKZ Berlin: DCD-Mapping von La₃Ta_{0,5}Ga_{3,5}O₁₄ (LTGO)

Dipl.-Phys. J. Piltz, amtec Analysenmesstechnik GmbH:
Kontinuierliche Beschichtungsmessungen im Prozess,
dargestellt an ausgewählten Beispielen

Prof. Dr. R. Herrmann, IAP e. V.: ³He/⁴He-Lösungskühler für
Tieftemperaturdetektoren

Dipl.-Phys. R. Fliegauf, PTB Berlin: Instrumentierung für die
RFA mit Synchrotronstrahlung

Freitag, 4. April 2003

Applikationen
Leitung: Dr. R. Meier

9.00 Uhr Dr. S. Baetzner, Anneliese Zementwerke AG:
Einsatz der Röntgenanalytik in der Zementindustrie

9.25 Uhr Dr. St. Stöber, MLU Halle: Röntgenanalyse von Baumaterialien

9.50 Uhr Dr. Chr. Genzel, Hahn-Meitner-Institut: Komplementäre
Materialforschung im Zentrum für Eigenspannungs- und
Texturanalyse (ZET) Von der Oberfläche zum Bauteilvolumen

10.15 Uhr Dr. B. Eigenmann, X-Ray Laboratory Christine Eigenmann:
Schaittach-Hormersdorf: Advantageous use of glass capilla-
ries as primary optics for X-ray residual stress analyses and
a novel concept for »micro diffraction« stress analysis

10.30 Uhr Dr. Flock, Thyssen Krupp Stahl AG: Prozessnahe Röntgen-
spektrometrie in der Eisen- und Stahlindustrie –
vom Rohstoff zum Produkt

11.55 Uhr Dr. A. Klein, Indutech GmbH: Neue Erfahrungen mit der
On-line-Elementanalyse mittels XRF

11.10 Uhr Dr. D. Wissmann, Spectro GmbH: The use of polarized light
ED-XRF for low sulfur content determination in automotive
fuels

11.35 Uhr Dr. O. Hahn, BAM: μ -X-ray fluorescence Spectrometry in art
and cultural studies

11.50 Uhr Dr. J. Wess, PANalytical GmbH: Eine neue Möglichkeit für die
Bestimmung von Spurenelementen in umweltrelevanten Proben

12.05 Uhr Dr. H.-J. Esche, amtec Analysenmesstechnik GmbH:
Prozessnahe Messung der Zusammensetzung und der Dicke
von Beschichtungen mit Hilfe von Röntgenstrahlung

12.30 Uhr Dr. M. Wilke, Universität Potsdam: Röntgenabsorptionsspek-
troskopie von Eisen in geologisch relevanten Systemen

12.45 Uhr – 13.30 Uhr Mittagspause

Kompakte Röntgenquellen für prozessnahe Anwendungen
Leitung Dr. J. Heckel

13.30 Uhr Dr. A. Bjeoumikhov, IfG GmbH: Kompakte Röntgenquelle
für RFA und Röntgendiffraktometrie als modular
aufgebautes System

13.45 Uhr Dr. M. Procop, BAM: Eine Mikrofokus-Röntgenquelle als
Zusatz zum Rasterelektronenmikroskop für die Röntgen-
fluoreszenzanalyse

**Kapillarroptiken und Monochromatoren
für die Strahlformierung**
Leitung Dr. R. Wedell

14.05 Uhr Prof. Dr. A. Erko, BESSY: Anwendungen von Röntgenoptiken
zur Strahlformierung in der Materialanalyse

14.30 Uhr Prof. Dr. X. Ding, Normal Beijing University: Progress of
polycapillary X-ray optics in China

14.50 Uhr Dr. L. Jiang, Osmic Inc.: Fundamentals of multilayer beam
conditioning optical systems

15.05 Uhr Dipl.- Phys. Th. Holz, AXO Dresden GmbH: Moderne Röntgen-
optiken und strahlformende Systeme auf der Basis von
Multischichten für die Diffraktometrie und Reflektometrie

15.20 Uhr Dr. C. Michaelsen, INCOATEC GmbH: Multilayer –
Spiegel für den harten und weichen Röntgenbereich

15.35 Uhr Dr. V. Arkadiev, IAP e. V.: Fokussierende Graphitkristall-
monochromatoren (HOPG) für Anwendungen in der
Medizintechnik

15.50 Uhr – 16.00 Uhr Kaffeepause

Neuartige Röntgendetektionssysteme
Leitung: Dipl.-Ing. Th. Schülein

16.00 Uhr Dr. O. Boslau, KETEK GmbH: Silizium Drift Detektoren (SDD) –
Stand der Technik und künftiger Trend

16.15 Uhr Dr. H. Soltau, PNSensor GmbH: Advances in Design and
Technology of Silicon Drift Detectors

16.30 Uhr Dr. R. Meier, PANalytical B.V.: Neuartige Röntgendetektoren
und ihre Anwendung in der industriellen Röntgenbeugung

16.45 Uhr Prof. Dr. L. Strüder, MPI für Extraterrestrische Physik:
High speed position resolved X-ray spectroscopy

17.15 Uhr Dipl.-Ing. M. Rohde, RÖNTEC GmbH: Ultraschnelle Spektro-
meter auf der Basis von Mehrkanal Silizium Drift Detektoren

* Gemeinsames Seminar mit dem Interdisziplinären
Forschungsverbund »UV- und Röntgentechnologien«

Eine begleitende Geräteausstellung wird vom IAP e.V.
organisiert.